

Préface

Ce présent numéro spécial de “Microscopy, Microanalysis, Microstructures” marque le 20^e anniversaire des réunions du Groupe Français de la Société Internationale pour la Stéréologie (I.S.S.), qui ont régulièrement lieu tous les ans, depuis février 1977.

Ce groupe est probablement le plus dynamique de l’I.S.S., et le côté informel de nos réunions a permis, et permet, non seulement de faire des mises au point thématiques, mais de provoquer de nombreuses discussions entre chercheurs de différentes disciplines: agronomes, gens des arts, astronomes, biologistes, botanistes, électroniciens, géologues, informaticiens, gens de la science des matériaux, mathématiciens, mécaniciens, médecins, ... Ces discussions traitent aussi bien d’aspects fondamentaux qu’appliqués, et concernent le développement de nouveaux sujets possibles.

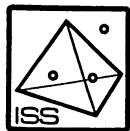
L’École Française, dite de Morphologie Mathématique, est la plus reconnue au niveau mondial. A partir de ses nombreux développements, et grâce aux progrès de l’informatique, on la retrouve dans de très nombreux laboratoires, comme un outil de base extrêmement courant et puissant, non seulement en France, mais dans la plupart des pays. En France, le dynamisme de ses chercheurs et de leurs travaux a permis de créer des centres très reconnus, comme le Centre de Morphologie Mathématique de l’École des Mines à Fontainebleau, le Pôle Traitement et Analyse d’Images (TAI) de Basse-Normandie qui a été reconnu et contractualisé par le Plan-Etat-Région avec le CNRS, le Groupement de Recherche GDR ISIS (Information-Signal-Image) sous l’égide du CNRS et du MENESR, ...

Ce numéro spécial rassemble un certain nombre d’activités centrées autour de l’analyse automatique d’images, de la morphologie mathématique et de la stéréologie. Il ne s’agit évidemment pas d’un bilan complet et exhaustif des travaux réalisés au cours de ces dix dernières années, faisant suite au volume du 10^e Anniversaire (*J. Microsc. Spectrosc. Electron.* 12 (1987) 1-200), mais de montrer différentes facettes et, par là même, la vitalité de notre groupe dans ce domaine. Le lecteur constatera la diversité et la richesse des exemples traités, qui concernent aussi bien une vue d’ensemble des travaux réalisés dans un laboratoire pendant ces dix dernières années, que les résultats d’une toute nouvelle recherche, ou bien encore d’une thématique que le laboratoire considère avoir été importante.

Après une brève introduction sur l’analyse d’images, la morphologie mathématique et la stéréologie, ce double numéro rassemble des articles sur l’analyse 3D et le contrôle industriel, la taille et la dispersion, la forme, les surfaces non planes et propriétés d’écoulement, et sur la modélisation.

Que tous ceux qui ont contribué à ce volume - auteurs, techniciens et aides de laboratoire, secrétaires, et referees - soient vivement remerciés, ainsi que M. le Dr C. Colliex, Éditeur en Chef de cette revue, qui a bien voulu nous accorder un double numéro pour cette manifestation. Enfin, tous, nous remercions l’École Nationale Supérieure des Mines de Paris, qui accueille gracieusement, tous les ans en février, le Groupe Français de la Société Internationale pour la Stéréologie.

Jean-Louis CHERMANT
Ancien Président de l’I.S.S.
Caen, le 6 février 1997



20^e Anniversaire de la Section Française
de la Société Internationale pour la Stéréologie